

2022年12月1日

各位

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡林 理
(コード：6920 東証プライム市場)
発表担当 執行役員 経営企画部長 三澤 祐太郎
(TEL.045-478-7111)

新製品 高感度内部欠陥検査/レビュー装置 CIRIUS シリーズを発表

高積層化プロセスに対応した高感度内部欠陥検査/レビュー装置

この度レーザーテックは、高感度内部欠陥検査/レビュー装置 CIRIUS シリーズを製品化致しました。

【説明】

半導体製造プロセスでは、線幅の微細化と並行して 3D NAND 等の高積層化が進んでおり、デバイス内部に発生する欠陥（内部欠陥）の解決が大きな課題となっています。

CIRIUS は、独自光学系によって内部欠陥の高感度な検査を可能にした装置で、レビューによる内部欠陥の深さ位置の特定と、深さ情報に基づく分類を実現しました。同装置により、従来の検査方式では対応できなかった内部欠陥を、非破壊で検査/レビューすることが可能で、お客様の製造ラインにおけるプロセスの早期改善や生産コストの削減への貢献が期待されます。

当社では今後も、先端半導体プロセスにおけるニーズにお応えし、半導体デバイスプロセスの品質改善、歩留まり向上に向けて貢献してまいります。

【特長】

- 独自光学系による高感度な内部欠陥検査
- レビュー光学系による、内部欠陥の深さ分類
- 高スループット検査

【用途】

- 3D NAND など高積層デバイスの高感度内部欠陥検査
- ウェハ貼り合わせ後の高感度内部欠陥検査



CIRIUS シリーズ

【本装置のお問い合わせ先】

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第2ソリューションセールス部 上菌 秀正

TEL : 045-478-7337

E-mail : hidemasa.uezono@lasertec.co.jp

以 上